

编号	ETBI30193
总页数	共 5 页

检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

产品名称: 时钟芯片

型号规格: RX-8025T

检验类别: 委托检验

生产单位: SEIKO EPSON CORPORATION

委托单位: 爱普生(中国)有限公司



中国赛(宝)实验室
元器元件报检中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，过期不予受理。
6. 一般情况，委托检验仪对来样负责。



地 址： 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号(27 路、138 路车经过)

通 信 处： 广州 1501 信箱工业和信息化部电子五所元器件检测中心

邮政编码： 510610

联系电话： 020-87237292、87236657

传 真： 020-87237149、87237181

投诉电话： 020-87237255、87236789

中国赛宝实验室 元器件检测中心 检验报告

产品名称	时钟芯片			型号规格	RX-8025T
				商 标	EPSON
生产单位	SEIKO EPSON CORPORATION			检验类别	委托检验
委托单位	爱普生（中国）有限公司			检验地点	本实验室
生产方地址	INA PLANT 8548 Nakaminowa, Minowa-machi, Kamina-gun, Nagano-ken, JAPAN				
委托方地址	中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层				
样品数量	20 只	送样者	同委托单位	送样日期	2013 年 10 月 18 日
抽样地点	/	基 数	/	生产批号	EN527D
样品编号	1#~20#		检验日期	2013 年 10 月 18 日~2013 年 10 月 22 日	
检验环境	温度: 15°C~35°C	相对湿度: 45%~75%	气压: 86kPa~106kPa		
检验项目	详见附件 1				
检验依据	委托方要求				
检验结论	本实验室对 RX-8025T 型时钟芯片按委托方要求进行检验, 结果合格。 (检验单位盖章) 签发日期: 2013 年 10 月 23 日				
说 明	本报告另附《检验记录》一份, 共 5 页。				

主检: 陈勇刚

审核: 王成

批准: 罗宏伟

2013.10.22

职务: 主任/副主任



附表 1 检验项目及技术要求

序号	检验项目	技 术 要 求	检 验 样 品 数 (只)	允 许 不 合 格 数 (只)	检 验 不 合 格 数 (只)	备 注
1	电压变化 影响实验	按产品规格说明书 Q09-203-11B 和检验委托说明书进行 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=2.2\text{V}\sim 5.5\text{V}$ 要求: 频率/电压特性 $\leq \pm 1.0 \times 10^{-6}/\text{V}$				
2	外观及标志	按产品规格说明书 Q09-203-11B 规定和委托检验要求进行 要求: 外观无损伤, 标志正确、清晰。	20	0	0	
3	尺寸	按产品规格说明书 Q09-203-11B 规定和委托检验要求进行 要求: 外形尺寸应符合委托方要求。				

附表 2 主要检验仪器、设备清单

序号	名称	型号、规格	计量有效期
1	直流电源	GPS-2303C	2013.01.16~2014.01.15
2	频率计	53132A	2013.01.09~2014.01.08
3	BVA 晶体频标	HRD-111	2013.07.10~2014.07.09
4	数字万用表	2000	2013.06.28~2014.06.27
5	电子数显卡尺	0~200mm	2012.12.18~2013.12.17

注: 本次检验均在使用仪器设备计量有效期内进行。

—————结 束—————

编号	ETB130193
总页数	共 5 页

检 验 记 录

产品名称: 时钟芯片

型号规格: RX-8025T

检验类别: 委托检验

生产单位: SEIKO EPSON CORPORATION

委托单位: 爱普生 (中国) 有限公司



中元
国器
赛宝
宝测
实验室中心



试验原始记录

生产 委托单位: 爱普生 (中国) 有限公司

样品数量: 20 只

产品名称 型号规格	时钟芯片 RX-8025T		组别	1
试验项目	外观及标志		环境温度	温度: 25 °C 湿度: 52 %RH
主要试验 设备名 称、型号	/	设备 编号	/	/
试验依据 标准条款	按委托方要求进行			
要求 试验条件	目测外观及标志。			
技术要求	外观无损伤, 标志正确、清晰			
实际 试验条件	目测外观及标志。			
样品 编号	试验结果			
1-20	合格.			
试验起始 结束时间	2013.10.21 ~ 2013.10.21			
备注	本项目检验 20 只合格, 0 只不合格, 本页记录更改盖章 0 处。			

试验者: 张世 日期: 2013.10.21 审核者: 周 日期: 2013.12.21



测试原始记录

生产 委托单位: 爱普生 (中国) 有限公司

样品数量: 20 只

产品名称 型号规格	时钟芯片 RX-8025T		组别	/
试验项目	尺寸	环境条件	温度: 25 °C 湿度: 52 %RH	
主要测试 仪器名称、 型号	电子数显卡尺 0~200mm	设备 编号	040010436	计 量 有 效 期 2012.12.18~2013.12.17
测试依据 标准条款	按委托方要求进行, 检查外形尺寸。			
测试参数	外形尺寸			
测试条件	/			
技术要求	10.1±0.2	7.4±0.2	3.2±0.1	
样品编号	测试结果 (mm)			
1	10.25	7.41	3.17	
2	10.24	7.40	3.17	
3	10.25	7.40	3.17	
4	10.24	7.40	3.18	
5	10.24	7.39	3.17	
6	10.24	7.40	3.17	
7	10.24	7.40	3.17	
8	10.24	7.40	3.17	
9	10.24	7.41	3.17	
10	10.25	7.39	3.17	
11	10.25	7.41	3.18	
12	10.24	7.41	3.17	
13	10.25	7.39	3.18	
14	10.24	7.40	3.17	
15	10.24	7.39	3.17	
备注	本项目检验 20 只合格, 0 只不合格, 本页记录更改盖章 0 处。			

测试者:

李俊伟 测试日期: 2013.10.21

审核者:

周中

审核日期:

2013.10.21

测试原始记录

□生产/☑委托单位: 爱普生(中国)有限公司

样品数量: 20

产品名称 型号规格	时钟芯片 RX-8025T		组别	/
试验项目	电压变化影响实验		环境条件	温度: 25 °C 湿度: 50 %RH
主要测试 仪器名 称、型号	频率计 53132A	设备编号	7521070006	2013.01.09~2014.01.08
	BVA 晶体频标 HRD-111	28A2192	计 量 有 效 期	2013.07.10~2014.07.09
	数字万用表 2000	0995072		2013.06.28~2014.06.27
测试依据 标准条款	产品规格说明书 Q09-203-11B 和检验委托说明书			
测试参数	电压变化影响实验 (频率/电压特性)			
测试条件	$T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=2.2\text{V}\sim 5.5\text{V}$			
技术要求	频率/电压特性 $\leq \pm 1.0 \times 10^{-6}/\text{V}$ (按规格书要求)			
样品编号	测 试 结 果			
	$f1(\text{Hz})$ ($V_{DD}=2.2\text{V}$)	$f2(\text{Hz})$ ($V_{DD}=5.5\text{V}$)	频率/电压特性($\times 10^{-6}/\text{V}$)	
1	32768.00587	32768.00920	0.031	
2	32767.99940	32768.00420	0.044	
3	32767.99854	32768.00020	0.015	
4	32768.00782	32768.01425	0.059	
5	32768.00561	32768.00480	-0.008	
6	32768.01465	32768.01463	-0.0002	
7	32768.00570	32768.00703	0.012	
8	32768.00854	32768.01420	0.052	
9	32768.01015	32768.01350	0.030	
10	32768.00552	32768.00580	0.002	
11	32768.00995	32768.01303	0.028	
12	32768.00375	32768.00961	0.054	

测试者: 陈勇刚 测试日期: 2013.10.20 审核者: 陈龙 审核日期: 2013.10.20

